

障害一覧

試験項目	単位	数値	推定される原因	認証測定器
ワイヤマップ (Wire map)	グラフでの表示	T568A/B	結線が正しいか、断線、短絡、クロスオーバー	信頼性の高い位置探知
DC抵抗 (DC Resistance)	オーム(Ω)	低いことが理想・ 全対の数値が同じ	過剰な配線長・間違った配線種類、よくない IDC接続、欠陥部品、配線の曲がり	
長さ (Length)	m	M(ISO/IECのみ表示)	過剰な配線長(リンク試験の場合、90mを超えてないか・チャンネル試験の場合、パッチコードや機械コードが長くないか)、間違ったNVP値、欠陥配線	正しいNVP値を確認
伝搬遅延時間 (Delay)	ナノ秒	低いことが理想・ 全対の数値が同じ	過剰な配線長、欠陥配線	
伝搬遅延時間差 (Delay Skew)	ナノ秒	低いことが理想	過剰な配線長、欠陥配線	
挿入損失 (IL)	dB(周波数上)	低いことが理想 全対の軌道は同じ	過剰な配線長、不適當な終端、 間違った配線の種類、欠陥配線	
近端漏話減衰量 (NEXT)	dB(周波数上)	高いことが理想	撚りの開きが大きい、対のスクリーンが不十分、間違ったコンポーネントか配線、試験コードかアダプタの消耗	NEXTロケータ機能を使用 ショートリンク補正(ISO/IEC: 4dBルール)
反射減衰量 (RL)	dB(周波数上)	高いことが理想	敷設配線が伸びている、不良配線、コンポーネント間のインピーダンスの mismatch	リターン・ロス機能を使用 低周波補正(3dBルール)
減衰対近端漏話比 (ACR-N)	dB(周波数上)	高いことが理想	NEXT及び/あるいは挿入損失	NEXTと挿入損失を元に計算されたパラメータ
減衰対遠端漏話比 (ACR-F:前 ELFEXT)	dB(周波数上)	高いことが理想	漏話及び/あるいは挿入損失	FEXTと挿入損失を元に計算されたパラメータ
PS-NEXT,PS-ACR-N,PS-ACR-F	dB(周波数上)	高いことが理想	基本の試験項目に言及	基本試験項目の個別対の合算